INNOVATION

Mesures Solutions EXPO2020

- SOCIETE EXPOSANTE

Polytec France

- Logo

Polytec

- INNOVATION PRESENTEE

Système de topographie de surface TopMap Micro.View+

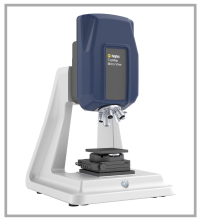
- DESCRIPTIF

Micro.View+ est le système de métrologie optique nouvelle génération. Les innovations « Focus Finder » (recherche de focus) et « Focus Tracker » (suivi du focus) améliorent considérablement la facilité d'utilisation dans toutes les conditions : contrôle qualité en laboratoire et ligne de production. De plus, la technologie de balayage continu « CST » permet d'utiliser toute la plage de déplacement comme plage de mesure étendue soit jusqu'à 100 mm. Quantification de la topographie de surface avec une résolution inférieure au nanomètre et capture les détails de manière fiable.

- TYPE / EXEMPLE D'APPLICATION

Analyse l'état de surface (forme, ondulation, rugosité, texture, topographie de microstructure) sur matériaux texturés, pièces usinés, revêtement de surface, science des matériaux, optiques, micro-pièces, appareillages.
Détection des défauts et distorsions visuelles avec l'analyse d'imagerie couleur.
Ex : micro-rugosité surfacique de rotule médicale. Hauteur de composants et

- ILLUSTRATION



- LIEN INTERNET

https://www.polytec.com/ir

- CONTACT

Soulard
Florent
f.soulard@polytec.fr